МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ» (ТУСУР)

У	ТВЕРЖДА	ΑЮ
Проректо	ор по учеб	ной работе
	П.В	. Сенченко
«18»	12	2019 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ СВЧ ЭЛЕКТРОНИКИ

Уровень образования: высшее образование - бакалавриат

Направление подготовки / специальность: 11.03.04 Электроника и наноэлектроника

Направленность (профиль) / специализация: Микроэлектроника и твердотельная электроника

Форма обучения: очная

Факультет: Факультет электронной техники (ФЭТ) Кафедра: Кафедра физической электроники (ФЭ)

Курс: **4** Семестр: **7**

Учебный план набора 2020 года

Объем дисциплины и виды учебной деятельности

Виды учебной деятельности	7 семестр	Всего	Единицы
Лекционные занятия	18	18	часов
Практические занятия	18	18	часов
Лабораторные занятия	16	16	часов
Самостоятельная работа	56	56	часов
Общая трудоемкость	108	108	часов
(включая промежуточную аттестацию)	3	3	3.e.

Формы промежуточной аттестация	Семестр
Зачет	7

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Сенченко П.В.

Должность: Прректор по УР Дата подписания: 18.12.2019 Уникальный программный ключ: a1119608-cdff-4455-b54e-5235117c185c

1. Общие положения

1.1. Цели дисциплины

1. Формирование научной основы и навыков, необходимых для разработки СВЧ монолитных интегральных схем.

1.2. Задачи дисциплины

1. Получение необходимых знаний по технологическим основам микроэлектроники СВЧ, методам расчёта пассивных и активных элементов интегральных схем, приобретение навыков проектирования интегральных схем.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок дисциплин: Б1. Дисциплины (модули).

Часть блока дисциплин: Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

Модуль дисциплин: Модуль направленности (профиля).

Индекс дисциплины: Б1.В.02.16.

Реализуется с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и основной образовательной программой (таблица 3.1):

Таблица 3.1 – Компетенции и индикаторы их достижения

T.C.	Индикаторы достижения	Планируемые результаты обучения по			
Компетенция	компетенции	дисциплине			
Универсальные компетенции					
-	-	-			
	Общепрофессиональны	е компетенции			
ОПК-2. Способен	ОПК-2.1. Знает основные	Знает основные принципы проведения			
самостоятельно	принципы проведения	экспериментальных исследований СВЧ			
проводить	экспериментальных	электроники и использования основных			
экспериментальные	исследований и	приемов обработки и представления			
исследования и	использования основных	полученных данных			
использовать основные	приемов обработки и				
приемы обработки и	представления полученных				
представления	данных				
полученных данных	ОПК-2.2. Умеет выбирать	Умеет выбирать эффективную методику			
	эффективную методику	экспериментальных исследований СВЧ			
	экспериментальных	электроники			
	исследований				
	ОПК-2.3. Владеет навыками	Владеет навыками проведения			
	проведения	экспериментальных исследований СВЧ			
	экспериментальных	электроники, обработки и представления			
	исследований, обработки и	полученных данных			
	представления полученных				
	данных				
	Профессиональные к	сомпетенции			

ПКР-8. Способен	ПКР-8.1. Знает основные	Знает основные стандарты по
организовывать	стандарты по	метрологическому обеспечению СВЧ
метрологического	метрологическому	электроники
обеспечение	обеспечению изделий	
производства	электронной техники	
материалов и изделий	ПКР-8.2. Умеет проводить	Умеет проводить измерения СВЧ
электронной техники	измерения в соответствии со	электроники в соответствии со
	стандартами	стандартами
	ПКР-8.3. Владеет навыками	Владеет навыками работы на стандартном
	работы на стандартном	измерительном оборудовании для СВЧ
	измерительном	электроники
	оборудовании	

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часов. Распределение трудоемкости дисциплины по видам учебной деятельности представлено в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Трудоемкость дисциплины по видам учебной деятельности

тиозищи ил трудосикость диециплины по видам у теоной деятельно	•	
Рини унобной подтоли ности	Всего	Семестры
Виды учебной деятельности		7 семестр
Контактная аудиторная работа обучающихся с преподавателем, всего	52	52
Лекционные занятия	18	18
Практические занятия	18	18
Лабораторные занятия	16	16
Самостоятельная работа обучающихся, в т.ч. контактная	56	56
внеаудиторная работа обучающихся с преподавателем, всего		
Подготовка к лабораторной работе, написание отчета	12	12
Написание отчета по лабораторной работе	6	6
Подготовка к тестированию	20	20
Подготовка к зачету	18	18
Общая трудоемкость (в часах)	108	108
Общая трудоемкость (в з.е.)	3	3

5. Структура и содержание дисциплины

5.1. Разделы (темы) дисциплины и виды учебной деятельности

Структура дисциплины по разделам (темам) и видам учебной деятельности приведена в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Разделы (темы) дисциплины и виды учебной деятельности

Tuomingu o.1 Tuogembi (1embi) gire	таолица 3.1 тазделы (темы) днециплины и виды у теоной деятельности					
Названия разделов (тем) дисциплины	Лек. зан.,	Прак.	Лаб.	Сам. раб.,	Всего часов (без	Формируемые
тизвания разделов (тем) днецивлины		зан., ч	раб.	ч Ч	,	компетенции
7 семестр						
1 Полупроводники в радиотехнике.	2	2	6	9	19	ОПК-2, ПКР-8
Структура и физические процессы.						
2 Полупроводниковые переходы и	2	-	6	9	17	ОПК-2, ПКР-8
контакты.						

3 Технологические основы микроэлектроники	2	-	4	9	15	ОПК-2, ПКР-8
4 Элементы интегральных схем.	2	4	_	5	11	ОПК-2, ПКР-8
5 Методы узкополосного и	2	1	-	6	9	ОПК-2, ПКР-8
широкополосного согласования						
интегральных схем.						
6 Расчёт и проектирование	2	4	-	3	9	ОПК-2, ПКР-8
согласующих цепей и фильтров.						
7 Пассивные устройства СВЧ.	2	2	-	5	9	ОПК-2, ПКР-8
Нагрузки, аттенюаторы, делители						
мощности, сплиттеры.						
8 Нелинейные элементы СВЧ и их	2	3	-	7	12	ОПК-2, ПКР-8
применение в микроэлектронике						
9 Компьютерное моделирование	2	2	-	3	7	ОПК-2, ПКР-8
интегральных схем						
Итого за семестр	18	18	16	56	108	
Итого	18	18	16	56	108	

5.2. Содержание разделов (тем) дисциплины

Содержание разделов (тем) дисциплины (в т.ч. по лекциям) приведено в таблице 5.2. Таблица 5.2 – Содержание разделов (тем) дисциплины (в т.ч. по лекциям)

Названия разделов (тем) дисциплины	Содержание разделов (тем) дисциплины (в т.ч. по лекциям)	Трудоемкость (лекционные занятия), ч	Формируемые компетенции
	7 семестр		
1 Полупроводники в	Полупроводники, применяемые в	2	ОПК-2, ПКР-8
радиотехнике. Структура	высокочастотной электронике.		
и физические процессы.	Носители заряда, энергетические		
	уровни и зоны. Распределение		
	носителей в зонах		
	проводимости.		
	Итого	2	
2 Полупроводниковые	Электронно-дырочные переходы.	2	ОПК-2, ПКР-8
переходы и контакты.	Контакт полупроводник-металл,		
	граница полупроводникдиэлектрик.		
	Итого	2	
3 Технологические	Подготовительные операции.	2	ОПК-2, ПКР-8
основы	Литография, эпитаксия, легирование.		
микроэлектроники	Техника масок, нанесение тонких		
	плёнок.		
	Итого	2	
4 Элементы интегральных	Способы изготовления активных и	2	ОПК-2, ПКР-8
схем.	реактивных нагрузок в интегральных		
	схемах СВЧ. Краткие сведения по		
	созданию нелинейных элементов.		
	Итого	2	

5 Методы узкополосного	Применение диаграммы Вольперта-	2	ОПК-2, ПКР-8
и широкополосного	Смита к расчёту, проектированию и		
согласования	анализу СВЧ устройств.		
интегральных схем.	Способы расчёта и построения		
	согласующих цепей.		
	Итого	2	
6 Расчёт и	Основы расчётов согласующих	2	ОПК-2, ПКР-8
проектирование	цепей. Фильтры		
согласующих цепей и	нижних и верхних частот,		
фильтров.	режекторные и полосовые фильтры.		
	Итого	2	
7 Пассивные устройства	Пассивные нагрузки. Основы	2	ОПК-2, ПКР-8
СВЧ. Нагрузки,	проектирования аттенюаторов Т- и		
аттенюаторы, делители	П-типов, резистивных делителей		
мощности, сплиттеры.	мощности и сплиттеров.		
	Итого	2	
8 Нелинейные элементы	Применение нелинейных элементов в	2	ОПК-2, ПКР-8
СВЧ и их применение в	микроэлектронике.		
микроэлектронике	Полупроводниковые диоды,		
	биполярные		
	и полевые транзисторы разных		
	типов.		
	Итого	2	
9 Компьютерное	Обзор систем автоматизированного	2	ОПК-2, ПКР-8
моделирование	проектирования радиотехнических		
интегральных схем	устройств СВЧ. Применение методов		
	электромагнитного анализа.		
	Итого	2	
	Итого за семестр	18	
	Итого	18	

5.3. Практические занятия (семинары)

Наименование практических занятий (семинаров) приведено в таблице 5.3. Таблица 5.3 – Наименование практических занятий (семинаров)

Названия разделов (тем)	Наименование практических	Трудоемкость,	Формируемые
дисциплины	занятий (семинаров)	Ч	компетенции
	7 семестр		
1 Полупроводники в	Переход металл-полупроводник, р-	2	ОПК-2, ПКР-8
радиотехнике. Структура	п-переход.		
и физические процессы.	Энергетические уровни и зоны.		
	Итого	2	

4 Элементы интегральных	Матрица рассеяния и её	2	ОПК-2, ПКР-8
схем.	применение в СВЧ		ŕ
	электротехнике. Выполнение		
	расчётных заданий по реактивным		
	цепям.		
	Микрополосковые, щелевые и	2	ОПК-2, ПКР-8
	копланарные линии		
	передачи. Выполнение расчётных		
	заданий.		
	Итого	4	
5 Методы узкополосного и	Решение задач с применением	1	ОПК-2, ПКР-8
широкополосного	диаграммы Вольперта-Смита.		
согласования	Примеры широкополосного		
интегральных схем.	согласования устройств.		
	Итого	1	
6 Расчёт и проектирование	Выполнение индивидуальных	4	ОПК-2, ПКР-8
согласующих цепей и	заданий по расчёту		
фильтров.	и моделированию фильтров СВЧ.		
	Итого	4	
7 Пассивные устройства	Решение задач построения	2	ОПК-2, ПКР-8
СВЧ. Нагрузки,	пассивных цепей. Работа в малых		
аттенюаторы, делители	группах по расчёту и		
мощности, сплиттеры.	моделированию		
	пассивных устройств.		
	Итого	2	
8 Нелинейные элементы	Схемы с применением диодов и	3	ОПК-2, ПКР-8
СВЧ и их применение в	транзисторов. Расчётные задания.		·
микроэлектронике	Итого	3	
9 Компьютерное	Работа по индивидуальным	2	ОПК-2, ПКР-8
моделирование	заданиям в САПР		, in the second
интегральных схем	Итого	2	
	Итого за семестр	18	
	Итого	18	
	111010		

5.4. Лабораторные занятия

Наименование лабораторных работ приведено в таблице 5.4. Таблица 5.4 — Наименование лабораторных работ

Названия разделов (тем)	Наименование лабораторных	Трудоемкость,	Формируемые
дисциплины	работ	Ч	компетенции
	7 семестр		
1 Полупроводники в радиотехнике. Структура и физические процессы.	Измерение концентрации и подвижности носителей заряда методом Холла	6	ОПК-2, ПКР-8
	Итого	6	
2 Полупроводниковые переходы и контакты.	Исследование температурной зависимости электропроводности примесных полупроводников	6	ОПК-2, ПКР-8
	Итого	6	

3 Технологические основы	Изучение эффекта Пельтье в	4	ОПК-2, ПКР-8
микроэлектроники	полупроводниках		
	Итого	4	
	16		
	Итого	16	

5.5. Курсовой проект / курсовая работа

Не предусмотрено учебным планом

5.6. Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции представлены в таблице 5.6.

Таблица 5.6 – Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции

Названия разделов (тем) дисциплины	Виды самостоятельной расос Виды самостоятельной работы	Трудоемкость,	Формируемые компетенции	Формы контроля
	7 ce	еместр		
1 Полупроводники в радиотехнике. Структура и	Подготовка к лабораторной работе, написание отчета	4	ОПК-2, ПКР-8	Лабораторная работа
физические процессы.	Написание отчета по лабораторной работе	2	ОПК-2, ПКР-8	Отчет по лабораторной работе
	Подготовка к тестированию	1	ОПК-2, ПКР-8	Тестирование
	Подготовка к зачету	2	ОПК-2, ПКР-8	Зачёт
	Итого	9		
2 Полупроводниковые переходы и контакты.	Подготовка к лабораторной работе, написание отчета	4	ОПК-2, ПКР-8	Лабораторная работа
	Написание отчета по лабораторной работе	2	ОПК-2, ПКР-8	Отчет по лабораторной работе
	Подготовка к тестированию	1	ОПК-2, ПКР-8	Тестирование
	Подготовка к зачету	2	ОПК-2, ПКР-8	Зачёт
	Итого	9		
3 Технологические основы	Подготовка к тестированию	1	ОПК-2, ПКР-8	Тестирование
микроэлектроники	Подготовка к лабораторной работе, написание отчета	4	ОПК-2, ПКР-8	Лабораторная работа
	Написание отчета по лабораторной работе	2	ОПК-2, ПКР-8	Отчет по лабораторной работе
	Подготовка к зачету	2	ОПК-2, ПКР-8	Зачёт
	Итого	9		

4 Элементы	Подготовка к	3	ОПК-2, ПКР-8	Тестирование
интегральных схем.	тестированию			
	Подготовка к зачету	2	ОПК-2, ПКР-8	Зачёт
	Итого	5		
5 Методы	Подготовка к	4	ОПК-2, ПКР-8	Тестирование
узкополосного и	тестированию			
широкополосного	Подготовка к зачету	2	ОПК-2, ПКР-8	Зачёт
согласования интегральных схем.	Итого	6		l
6 Расчёт и	Подготовка к	1	ОПК-2, ПКР-8	Тестирование
проектирование	тестированию			
согласующих цепей и	Подготовка к зачету	2	ОПК-2, ПКР-8	Зачёт
фильтров.	Итого	3		
7 Пассивные	Подготовка к	3	ОПК-2, ПКР-8	Тестирование
устройства СВЧ.	тестированию			
Нагрузки, аттенюаторы,	Подготовка к зачету	2	ОПК-2, ПКР-8	Зачёт
делители мощности, сплиттеры.	Итого	5		
8 Нелинейные	Подготовка к	5	ОПК-2, ПКР-8	Тестирование
элементы СВЧ и их	тестированию			
применение в	Подготовка к зачету	2	ОПК-2, ПКР-8	Зачёт
микроэлектронике	Итого	7		
9 Компьютерное	Подготовка к	1	ОПК-2, ПКР-8	Тестирование
моделирование	тестированию			
интегральных схем	Подготовка к зачету	2	ОПК-2, ПКР-8	Зачёт
	Итого	3		
	Итого за семестр	56		
	Итого	56		

5.7. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов учебной деятельности

Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов учебной деятельности представлено в таблице 5.7.

Таблица 5.7 – Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий

Формануомило	Виды учебной деятельности				
Формируемые компетенции	Лек.	Прак.	Лаб.	Сам.	Формы контроля
компетенции	зан.	зан.	раб.	раб.	
ОПК-2	+	+	+	+	Зачёт, Лабораторная работа,
					Тестирование, Отчет по лабораторной
					работе
ПКР-8	+	+	+	+	Зачёт, Лабораторная работа,
					Тестирование, Отчет по лабораторной
					работе

6. Рейтинговая система для оценки успеваемости обучающихся

6.1. Балльные оценки для форм контроля

Балльные оценки для форм контроля представлены в таблице 6.1. Таблица 6.1 – Балльные оценки

Формы контроля	Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра	Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ	Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра	Всего за семестр
	-	7 семестр		
Зачёт	0	0	30	30
Лабораторная работа	0	5	10	15
Тестирование	10	10	10	30
Отчет по лабораторной работе	0	10	15	25
Итого максимум за период	10	25	65	100
Нарастающим итогом	10	35	100	100

6.2. Пересчет баллов в оценки за текущий контроль

Пересчет баллов в оценки за текущий контроль представлен в таблице 6.2.

Таблица 6.2 – Пересчет баллов в оценки за текущий контроль

Баллы на дату текущего контроля	Оценка
≥ 90% от максимальной суммы баллов на дату ТК	5
От 70% до 89% от максимальной суммы баллов на дату ТК	
От 60% до 69% от максимальной суммы баллов на дату ТК	
< 60% от максимальной суммы баллов на дату ТК	2

6.3. Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку представлен в таблице 6.3.

Таблица 6.3 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

	\mathbf{r}	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>
Оценка	Итоговая сумма баллов, учитывает успешно сданный	Оценка (ECTS)
	экзамен	
5 (отлично) (зачтено)	90 - 100	А (отлично)
4 (хорошо) (зачтено)	85 – 89	В (очень хорошо)
	75 – 84	С (хорошо)
	70 – 74	D (удовлетворительно)
3 (удовлетворительно) (зачтено)	65 – 69	
	60 - 64	Е (посредственно)
2 (неудовлетворительно) (не зачтено)	Ниже 60 баллов	F (неудовлетворительно)

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1. Основная литература

- 1. Учебное пособие «Микроэлектроника» : Для направления подготовки 210100.62 «Электроника и наноэлектроника». Профиль: «Промышленная электроника» / Н. С. Легостаев 2013. 172 с. [Электронный ресурс]: Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/4280.
- 2. Электроника. Часть 1: Учебное пособие / В. М. Ицкович, В. А. Шалимов 2016. 209 с. [Электронный ресурс]: Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/7278.
- 3. Электроника. Часть 2: Учебное пособие / В. М. Ицкович, В. А. Шалимов 2016. 120 с. [Электронный ресурс]: Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/7279.

4. Ефимов, И. Е. Основы микроэлектроники : учебник / И. Е. Ефимов, И. Я. Козырь. — 3-е изд. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 384 с. — ISBN 978-5-8114-0866-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. [Электронный ресурс]: — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/210218.

7.2. Дополнительная литература

- 1. Данилин В.Н. Аналоговые полупроводниковые интегральные схемы СВЧ / Валентин Николаевич Данилин, А.И. Кушниренко, Гарри Васильевич Петров. М.: Радио и связь, 1985. 192 с. (наличие в библиотеке ТУСУР 21 экз.).
- 2. Маттей Д. Л. Фильтры СВЧ, согласующие цепи и цепи связи / Д. Л. Маттей, Л. Янг, Е. М. Т. Джонс // пер с англ., ред.: Л. В. Алексеев, Ф. В. Кушнир. М. : Связь, 1972. Т. 1. 438 с. (наличие в библиотеке ТУСУР 15 экз.).
- 3. Старосельский, В. И. Физика полупроводниковых приборов микроэлектроники: учебное пособие для вузов / В. И. Старосельский. Москва: Издательство Юрайт, 2022. 463 с. (Бакалавр. Академический курс). ISBN 978-5-9916-0808-4. Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. [Электронный ресурс]: Режим доступа: https://urait.ru/bcode/509181.

7.3. Учебно-методические пособия

7.3.1. Обязательные учебно-методические пособия

- 1. Твердотельные приборы и устройства: Методические указания по самостоятельной работе для студентов направления 210100.62 Электроника и наноэлектроника / Л. Н. Орликов 2013. 17 с. [Электронный ресурс]: Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/3469.
- 2. Физика конденсированного состояния: Учебно-методическое пособие по лабораторным работам для студентов направления подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника», профиль «Промышленная электроника» / Е. В. Саврук, В. В. Каранский, С. В. Смирнов 2016. 43 с. [Электронный ресурс]: Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/6275.
- 3. Твердотельные приборы и устройства: Методические указания к практическим занятиям для студентов направления 200700.62 «Фотоника и оптоинформатика» / Л. Н. Орликов 2013. 25 с. [Электронный ресурс]: Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/3473.

7.3.2. Учебно-методические пособия для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной работы обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.

Для лиц с нарушениями зрения:

- в форме электронного документа;
- в печатной форме увеличенным шрифтом.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в форме электронного документа;
- в печатной форме.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в форме электронного документа;
- в печатной форме.

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

- 1. При изучении дисциплины рекомендуется обращаться к современным базам данных, информационно-справочным и поисковым системам, к которым у ТУСУРа открыт доступ: https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh.
 - 8. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины

8.1. Материально-техническое и программное обеспечение для лекционных занятий

Для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций,

10

текущего контроля и промежуточной аттестации используется учебная аудитория с достаточным количеством посадочных мест для учебной группы, оборудованная доской и стандартной учебной мебелью. Имеются мультимедийное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по лекционным разделам дисциплины.

8.2. Материально-техническое и программное обеспечение для практических занятий

Учебно-исследовательская лаборатория "Микроволновая техника": учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий практического типа, учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, помещение для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), помещение для проведения групповых и индивидуальных консультаций, помещение для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации; 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 47, 328 ауд.

Описание имеющегося оборудования:

- Проектор;
- Проекционный экран;
- Осциллограф GDS-71022;
- Измеритель P2M-18;
- Генератор сигнала 33522А;
- Вольтметр циф. GDM 8145;
- Измеритель Р2М-04;
- Анализатор спектра СК4М-04;
- Осциллограф цифровой MS07104;
- Мультиметр цифровой 34405А;
- Источник питания GPD-73303S;
- Генератор Г4-126;
- Измеритель Р2-60 2 блока;
- Измеритель Р5-12;
- Измерительная линия Р1-27;
- Векторный анализатор сигналов Р4М-18;
- Опорно-поворотное устройство;
- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.

Программное обеспечение:

- Adobe Acrobat Reader;
- Keysight Advanced Design System (ADS);
- Keysight Electromagnetic Professional (EMPro);
- Keysight SystemVue;
- Microsoft Office 2010;
- Microsoft Windows 8;

8.3. Материально-техническое и программное обеспечение для лабораторных работ

Учебно-исследовательская лаборатория "Микроволновая техника": учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий практического типа, учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, помещение для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), помещение для проведения групповых и индивидуальных консультаций, помещение для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации; 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 47, 328 ауд.

Описание имеющегося оборудования:

- Проектор;
- Проекционный экран;
- Осциллограф GDS-71022;
- Измеритель Р2М-18;
- Генератор сигнала 33522А;
- Вольтметр циф. GDM 8145;

- Измеритель Р2М-04;
- Анализатор спектра СК4М-04;
- Осциллограф цифровой MS07104;
- Мультиметр цифровой 34405А;
- Источник питания GPD-73303S;
- Генератор Г4-126;
- Измеритель Р2-60 2 блока;
- Измеритель Р5-12;
- Измерительная линия Р1-27;
- Векторный анализатор сигналов Р4М-18;
- Опорно-поворотное устройство;
- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.

Программное обеспечение:

- Adobe Acrobat Reader;
- Keysight Advanced Design System (ADS);
- Keysight Electromagnetic Professional (EMPro);
- Keysight SystemVue;
- Microsoft Office 2010;
- Microsoft Windows 8;

8.4. Материально-техническое и программное обеспечение для самостоятельной работы

Для самостоятельной работы используются учебные аудитории (компьютерные классы), расположенные по адресам:

- 634050, Томская область, г. Томск, Ленина проспект, д. 40, 233 ауд.;
- 634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 201 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 47, 126 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 74, 207 ауд.

Описание имеющегося оборудования:

- учебная мебель;
- компьютеры;
- компьютеры подключены к сети «Интернет» и обеспечивают доступ в электронную информационно-образовательную среду ТУСУРа.

Перечень программного обеспечения:

- Microsoft Windows:
- OpenOffice;
- Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;
- 7-Zip;
- Google Chrome.

8.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Освоение дисциплины лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.

При занятиях с обучающимися с **нарушениями слуха** предусмотрено использование звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы преподавания для обучающихся с инвалидностью, портативной индукционной системы. Учебная аудитория, в которой занимаются обучающиеся с нарушением слуха, оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой.

При занятиях с обучающимися с нарушениями зрения предусмотрено использование в лекционных и учебных аудиториях возможности просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для комфортного просмотра.

При занятиях с обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются альтернативные устройства ввода информации и другие технические средства

приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы обучения для людей с инвалидностью.

9. Оценочные материалы и методические рекомендации по организации изучения дисциплины

9.1. Содержание оценочных материалов для текущего контроля и промежуточной аттестации

Для оценки степени сформированности и уровня освоения закрепленных за дисциплиной компетенций используются оценочные материалы, представленные в таблице 9.1.

Таблица 9.1 – Формы контроля и оценочные материалы

Названия разделов (тем) дисциплины	Формируемые компетенции	Формы контроля	Оценочные материалы (ОМ)
1 Полупроводники в радиотехнике. Структура и	ОПК-2, ПКР-8	Зачёт	Перечень вопросов для зачета
физические процессы.		Лабораторная работа	Темы лабораторных работ
		Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
		Отчет по лабораторной работе	Темы лабораторных работ
2 Полупроводниковые переходы и контакты.	ОПК-2, ПКР-8	Зачёт	Перечень вопросов для зачета
		Лабораторная работа	Темы лабораторных работ
		Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
		Отчет по лабораторной работе	Темы лабораторных работ
3 Технологические основы микроэлектроники	ОПК-2, ПКР-8	Зачёт	Перечень вопросов для зачета
		Лабораторная работа	Темы лабораторных работ
		Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
		Отчет по лабораторной работе	Темы лабораторных работ
4 Элементы интегральных схем.	ОПК-2, ПКР-8	Зачёт	Перечень вопросов для зачета
		Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
5 Методы узкополосного и широкополосного	ОПК-2, ПКР-8	Зачёт	Перечень вопросов для зачета
согласования интегральных схем.		Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий

6 Расчёт и проектирование согласующих цепей и	ОПК-2, ПКР-8	Зачёт	Перечень вопросов для зачета
фильтров.		Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
7 Пассивные устройства СВЧ. Нагрузки, аттенюаторы,	ОПК-2, ПКР-8	Зачёт	Перечень вопросов для зачета
делители мощности, сплиттеры.		Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
8 Нелинейные элементы СВЧ и их применение в	ОПК-2, ПКР-8	Зачёт	Перечень вопросов для зачета
микроэлектронике		Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий
9 Компьютерное моделирование интегральных	ОПК-2, ПКР-8	Зачёт	Перечень вопросов для зачета
схем		Тестирование	Примерный перечень тестовых заданий

Шкала оценки сформированности отдельных планируемых результатов обучения по дисциплине приведена в таблице 9.2.

Таблица 9.2 – Шкала оценки сформированности планируемых результатов обучения по лисциплине

дисциплине				
Оценка	Баллы за ОМ	Формулировка требований к степени сформированности планируемых результатов обучения		
		знать	уметь	владеть
2	< 60% от	отсутствие знаний	отсутствие	отсутствие
(неудовлетворительно)	максимальной	или фрагментарные	умений или	навыков или
	суммы баллов	знания	частично	фрагментарные
			освоенное	применение
			умение	навыков
3	от 60% до	общие, но не	в целом успешно,	в целом
(удовлетворительно)	69% от	структурированные	но не	успешное, но не
	максимальной	знания	систематически	систематическое
	суммы баллов		осуществляемое	применение
			умение	навыков
4 (хорошо)	от 70% до	сформированные,	в целом	в целом
	89% от	но содержащие	успешное, но	успешное, но
	максимальной	отдельные	содержащие	содержащие
	суммы баллов	проблемы знания	отдельные	отдельные
			пробелы умение	пробелы
				применение
				навыков
5 (отлично)	≥ 90% ot	сформированные	сформированное	успешное и
	максимальной	систематические	умение	систематическое
	суммы баллов	знания		применение
				навыков

Шкала комплексной оценки сформированности компетенций приведена в таблице 9.3. Таблица 9.3 – Шкала комплексной оценки сформированности компетенций

Оценка Формулировка требований к степени ком	ипетенции
--	-----------

2	Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале			
(неудовлетворительно)				
(пеудовлетворительно)				
	Знать на уровне ориентирования, представлений. Обучающийся знает			
	основные признаки или термины изучаемого элемента содержания, их			
	отнесенность к определенной науке, отрасли или объектам, узнает в			
	текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источникам нужно			
	обращаться для более детального его усвоения.			
3	Знать и уметь на репродуктивном уровне. Обучающихся знает			
(удовлетворительно)	изученный элемент содержания репродуктивно: произвольно			
	воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых			
	действиях.			
4 (хорошо)	Знать, уметь, владеть на аналитическом уровне. Зная на			
	репродуктивном уровне, указывать на особенности и взаимосвязи			
	изученных объектов, на их достоинства, ограничения, историю и			
	перспективы развития и особенности для разных объектов усвоения.			
5 (отлично)	Знать, уметь, владеть на системном уровне. Обучающийся знает			
	изученный элемент содержания системно, произвольно и доказательно			
	воспроизводит свои знания устно, письменно или в демонстрируемых			
	действиях, учитывая и указывая связи и зависимости между этим			
	элементом и другими элементами содержания дисциплины, его			
	значимость в содержании дисциплины.			

9.1.1. Примерный перечень тестовых заданий

1. К диапазону сверхвысокочастотного излучения относятся радиоволны с диапазоном:

от 3 ГГц до 3 ТГц

от 300 МГц до 300 ГГц

от 30 МГц до 30 ГГц

от 100 МГц до 100 ГГц

Литография – это:

процедура переноса изображения на подложку

уменьшение толщины подложки

способ соединения подложек

способ травления

3. Коэффициент стоячей волны определяется:

отношением модулей коэффициентов отражения и передачи

длиной линии передачи

максимальной допустимой мощностью линии передачи

качеством согласования нагрузки с линией передачи

4. Вольт-амперная характеристика диода – это зависимость:

тока пробоя от напряжения на катоде

напряжения на выводах диода от тока смещения

тока, протекающего через диод, от приложенного напряжения

напряжения на выводах диода от тока утечки

5. На круговой диаграмме комплексных сопротивлений Вольперта-Смита на горизонтальной линии отмечены:

уровни нормированного реактивного сопротивления

уровни нормированного активного сопротивления

значение модуля комплексного коэффициента отражения

значение модуля комплексного коэффициента передачи

6. Коэффициент стоячей волны может принимать значения:

от -1 до 1

от 0 ло ∞

от 1 до ∞

от 0 до 1

7. Аттенюаторы СВЧ сигналов применяют для:

коррекции частотной характеристики в узкой полосе частот

усиления мошности сигналов CBЧ

ослабления мощности сигналов СВЧ

изменения фазы сигналов СВЧ

8. Фотошаблон – это:

пластина из полупроводника, на которой выполняют выращивание компонентов микросхем

процедура удаления изображения

пластина либо полимерная пленка со сформированным на её поверхности рисунком элементов схем

процедура нанесения изображения

9. Какой формулой связаны частота и длина волны:

```
c = f \cdot \lambda
```

 $\lambda = f \cdot c$

 $c = f/\lambda$

 $f = \lambda \cdot c$

10. Легирование - это:

процедура несения примесей в материал

способ травления

нанесение изображения на поверхность материала

способ резки полупроводника

11. Коэффициент стоячей волны и коэффициент отражения связаны выражением:

```
KCB = (|\Gamma|+1)/(|\Gamma|-1)
```

 $KCB=(|\Gamma|-1)/(|\Gamma|+1)$

 $KCB = (1+|\Gamma|)/(1-|\Gamma|)$

 $KCB = (1-|\Gamma|)/(1+|\Gamma|)$

12. Валентная зона это:

самая верхняя полностью заполненная энергетическая зона;

самая нижняя полностью заполненная энергетическая зона; самая верхняя полностью свободная энергетическая зона;

самая нижняя полностью свободная энергетическая зона.

13. У каких кристаллов ширина запрещённой зоны наибольшая?

полупроводники

диэлектрики

металлы

у всех кристаллов одинаковая ширина запрещённой зоны

14. Что занимает промежуточную область между проводниками и диэлектриками?

катод

анод

проводник

полупроводник

15. Сколько р-п переходов имеет биполярный транзистор

1

2

3

4

16. Полупроводниковый диод, работа которого основана на зависимости барьерной ёмкости р-п-перехода от обратного напряжения называется:

диод Шоттки

варикап

стабилитрон

вариконд

17. Элемент S21 матрицы рассеяния четырехполюсника означает: коэффициент передачи от первого порта на второй при согласованной нагрузке коэффициент отражения от второго порта при согласовании первого порта коэффициент передачи от второго порта на первый при согласованной нагрузке коэффициент отражения от первого порта при согласовании

второго порта

18. Коэффициент бегущей волны может принимать значения:

от -1 до 1

от 1 до ∞

от 0 до 1

от -1 до 0

19. Элемент S11 матрицы рассеяния четырехполюсника означает:

коэффициент передачи от первого порта на второй при согласованной нагрузке коэффициент отражения от второго порта при согласовании первого порта коэффициент передачи от второго порта на первый при согласованной нагрузке коэффициент отражения от первого порта при согласовании второго порта

20. Фильтр высоких частота используется для:

для подавления сигнала на частотах ниже частоты среза

для подавления сигнала на частотах выше частоты среза

для изменения амплитуды сигнала

для переноса сигнала на другую частоту

9.1.2. Перечень вопросов для зачета

- 1. Пояснить смысл понятия «микроэлектроника».
- 2. Основные преимущества приборов, выполненных на интегральных схемах по сравнению с приборами, выполненными на дискретных компонентах.
- 3. Каковы особенности схемотехнических решений в микроэлектронике.
- 4. Что такое интегральная схема?
- 5. Что такое основные и неосновные носители?
- 6. Нарисуйте энергетические зоны металла, полупроводника и диэлектрика. В чём их отличие?
- 7. Донорные и акцепторные примеси в полупроводниках.
- 8. Нарисуйте ВАХ идеализированного р-п-перехода.
- 9. Охарактеризуйте виды пробоя р-п-перехода.
- 10. Что такое барьер Шоттки?
- 11. Основные качества диода Шоттки и преимущества по сравнению с обычным р-п-переходом.
- 12. Основные схемы включения биполярных транзисторов.
- 13. Входная и выходная вольт-амперные характеристики биполярного транзистора.
- 14. Усилительный каскад с общим эмиттером. Пояснить причину инвертирования входного сигнала.
- 15. Усилительный каскад с общим эмиттером. Нарисовать схему и пояснить назначение каждого элемента.
- 16. Почему для изготовления большинства полупроводниковых приборов используются монокристаллические материалы?
- 17. Основные операции технологического процесса изготовления интегральных схем.
- 18. Какие типы корпусов интегральных схем вам знакомы? Основные отличия.
- 19. Что такое шариковые и балочные выводы?
- 20. Литография. Определение, назначение. Какие виды литографии вам знакомы
- 21. Эпитаксия. Гетероэпитаксия и гомоэпитаксия. Определения.
- 22. Фотошаблон. Для чего применяется, способы изготовления.
- 23. Легирование. Травление. Определения, назначение.
- 24. Термическое окисление. Основные функции.
- 25. Матрица рассеяния четырехполюсника. Определения элементов матрицы.
- 26. С чем связаны сложности построения радиотехнических устройств сверхвысоких частот.
- 27. Прямоугольные волноводы. Коаксиальная линия передачи. Рисунки, назначение,
- 28. Диаграмма комплексных сопротивлений Вольперта Смита. Пояснение основных составляющих диаграммы.
- 29. Структура биполярного транзистора. Рисунок, пояснения принципа работы транзистора.
- 30. Структуру полевого транзистора. Рисунок, пояснения принципа работы транзистора.

9.1.3. Темы лабораторных работ

- 1. Измерение концентрации и подвижности носителей заряда методом Холла
- 2. Исследование температурной зависимости электропроводности примесных полупроводников
- 3. Изучение эффекта Пельтье в полупроводниках

9.2. Методические рекомендации

Учебный материал излагается в форме, предполагающей самостоятельное мышление студентов, самообразование. При этом самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса.

Начать изучение дисциплины необходимо со знакомства с рабочей программой, списком учебно-методического и программного обеспечения. Самостоятельная работа студента включает работу с учебными материалами, выполнение контрольных мероприятий, предусмотренных учебным планом.

В процессе изучения дисциплины для лучшего освоения материала необходимо регулярно обращаться к рекомендуемой литературе и источникам, указанным в учебных материалах; пользоваться через кабинет студента на сайте Университета образовательными ресурсами электронно-библиотечной системы, а также общедоступными интернет-порталами, содержащими научно-популярные и специализированные материалы, посвященные различным аспектам учебной дисциплины.

При самостоятельном изучении тем следуйте рекомендациям:

- чтение или просмотр материала осуществляйте со скоростью, достаточной для индивидуального понимания и освоения материала, выделяя основные идеи; на основании изученного составить тезисы. Освоив материал, попытаться соотнести теорию с примерами из практики;
- если в тексте встречаются незнакомые или малознакомые термины, следует выяснить их значение для понимания дальнейшего материала;
 - осмысливайте прочитанное и изученное, отвечайте на предложенные вопросы.

Студенты могут получать индивидуальные консультации, в т.ч. с использованием средств телекоммуникации.

По дисциплине могут проводиться дополнительные занятия, в т.ч. в форме вебинаров. Расписание вебинаров и записи вебинаров публикуются в электронном курсе / электронном журнале по дисциплине.

9.3. Требования к оценочным материалам для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусмотрены дополнительные оценочные материалы, перечень которых указан в таблице 9.2.

Таблица 9.2 – Дополнительные материалы оценивания для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

возможностями здоровья и инванидов					
Категории обучающихся	Виды дополнительных оценочных	Формы контроля и оценки			
категории обучающихся	материалов	результатов обучения			
С нарушениями слуха	Тесты, письменные	Преимущественно письменная			
	самостоятельные работы, вопросы	проверка			
	к зачету, контрольные работы				
С нарушениями зрения	Собеседование по вопросам к	Преимущественно устная			
	зачету, опрос по терминам	проверка (индивидуально)			
С нарушениями опорно-	Решение дистанционных тестов,	Преимущественно			
двигательного аппарата	контрольные работы, письменные	дистанционными методами			
	самостоятельные работы, вопросы				
	к зачету				

С ограничениями по	Тесты, письменные	Преимущественно проверка	
общемедицинским	самостоятельные работы, вопросы	е работы, вопросы методами, определяющимися	
показаниям	к зачету, контрольные работы,	исходя из состояния	
	устные ответы	обучающегося на момент	
		проверки	

9.4. Методические рекомендации по оценочным материалам для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной форме;
- в печатной форме с увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- методом чтения ассистентом задания вслух;
- предоставление задания с использованием сурдоперевода.

Лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге;
- набор ответов на компьютере;
- набор ответов с использованием услуг ассистента;
- представление ответов устно.

Процедура оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

- в форме электронного документа;
- в печатной форме увеличенным шрифтом.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в форме электронного документа;
- в печатной форме.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в форме электронного документа;
- в печатной форме.

При необходимости для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры СВЧиКР протокол № 4 от « 28 » _ 11 _ 2019 г.

СОГЛАСОВАНО:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Заведующий выпускающей каф. ФЭ	П.Е. Троян	Согласовано, 1c6cfa0a-52a6-4f49- aef0-5584d3fd4820
Заведующий обеспечивающей каф. СВЧиКР	С.Н. Шарангович	Согласовано, b7d1ae21-2df2-4bc3- 9352-43aa04a5b956
Начальник учебного управления	Е.В. Саврук	Согласовано, fa63922b-1fce-4a6a- 845d-9ce7670b004c
ЭКСПЕРТЫ:		
Старший преподаватель, каф. ФЭ	В.В. Каранский	Согласовано, c2e55ae8-0332-4ed9- a65a-afbb92539ee8
Заведующий кафедрой, каф. СВЧиКР	С.Н. Шарангович	Согласовано, b7d1ae21-2df2-4bc3- 9352-43aa04a5b956
РАЗРАБОТАНО:		
Доцент, каф. СВЧиКР	А.Ю. Попков	Разработано, 52ae2e71-055b-4e34- bcfc-4f3ea312644e
Профессор, каф. КСУП	А.Н. Сычев	Разработано, ede1030c-8878-415e- bc8d-e641f6110eed
Доцент, каф. СВЧиКР	А.С. Загородний	Разработано, f91f21ca-5b0d-47a2- a329-d42601b9da4e